

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
115-6-101
QC 400401XX0001**

Première édition
First edition
1992-04

**Résistances fixes utilisées dans
les équipements électroniques**

Partie 6:

Spécification particulière:

Réseau de résistances fixes à couches épaisses,
de valeur égale et de dissipation égale, mesurables
individuellement, de classe 1
(configuration double en ligne)

Fixed resistors for use in electronic equipment

Part 6:

Detail specification:

Fixed thick film resistor networks with
individually measurable resistors,
all of equal value and equal dissipation, class 1
(dual-in-line network)



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 115-6-101: 1992

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)*.

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

115-6-101
QC 400401XX0001

Première édition
First edition
1992-04

**Résistances fixes utilisées dans
les équipements électroniques**

Partie 6:

Spécification particulière:

Réseau de résistances fixes à couches épaisses,
de valeur égale et de dissipation égale, mesurables
individuellement, de classe 1
(configuration double en ligne)

Fixed resistors for use in electronic equipment

Part 6:

Detail specification:

Fixed thick film resistor networks with
individually measurable resistors,
all of equal value and equal dissipation, class 1
(dual-in-line network)

© CEI 1992 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
SIXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE:
RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES EPAISSES,
DE VALEUR EGALE ET DE DISSIPATION EGALE, MESURABLES INDIVIDUELLEMENT,
DE CLASSE 1. (CONFIGURATION DOUBLE EN LIGNE)

PREAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
40(BC)624	40(BC)685

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote correspondant mentionné dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 6: DETAIL SPECIFICATION:
FIXED THICK FILM RESISTOR NETWORKS WITH INDIVIDUALLY
MEASURABLE RESISTORS, ALL OF EQUAL VALUE AND EQUAL DISSIPATION,
CLASS 1. (DUAL-IN-LINE NETWORK)

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

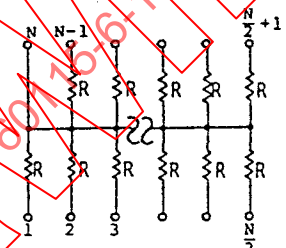
This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
40(CO)624	40(CO)685

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE	CEI 115-6-101 QC 400401XX0001
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A: PUBLICATION 115-6 de la CEI	CEI 115-6-1 QC 400401
Croquis d'encombrement: voir page 6	RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES EPAISSES, DE VALEUR EGALE ET DE DISSIPATION EGALE, MESURABLES INDIVIDUELLEMENT (CONFIGURATION DOUBLE EN LIGNE)
	N = NOMBRE DE SORTIES  Technologie de base: Circuit à couche épaisse. N = 14 ou 16. Réseau isolé.
	Niveau d'assurance: E Classe de stabilité: 1 %

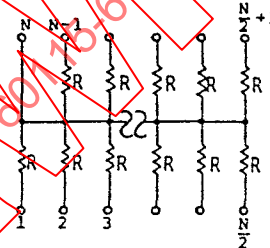
Les informations sur la disponibilité de composants qualifiés selon cette spécification particulière sont données dans la Liste des Produits Qualifiés.

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE DE MONTAGE RECOMMANDEE

Ces réseaux de résistances sont conçus pour la soudure sur un circuit imprimé et doivent ainsi être montés pour essai suivant le paragraphe 3.1.1.b de la Publication 68-2-6 de la CEI et du paragraphe 3.3.1.b de la Publication 68-2-29 de la CEI: Fixer les sorties seulement.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION	IEC 115-6-101 QC 400401XX0001
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN ACCORDANCE WITH: IEC PUBLICATION 115-6	IEC 115-6-1 QC 400401
Outline drawing: see page 7	FIXED THICK FILM RESISTOR NETWORKS WITH INDIVIDUALLY MEASURABLE RESISTORS, ALL OF EQUAL VALUE AND EQUAL DISSIPATION (DUAL-IN-LINE NETWORK)
	N = NUMBER OF TERMINALS  Typical construction: Thick film circuit. N = 14 or 16. Insulated network.
	Assessment level: E Stability class: 1 %

Information on the availability of components
qualified to this detail specification is given
in the Qualified Products List.

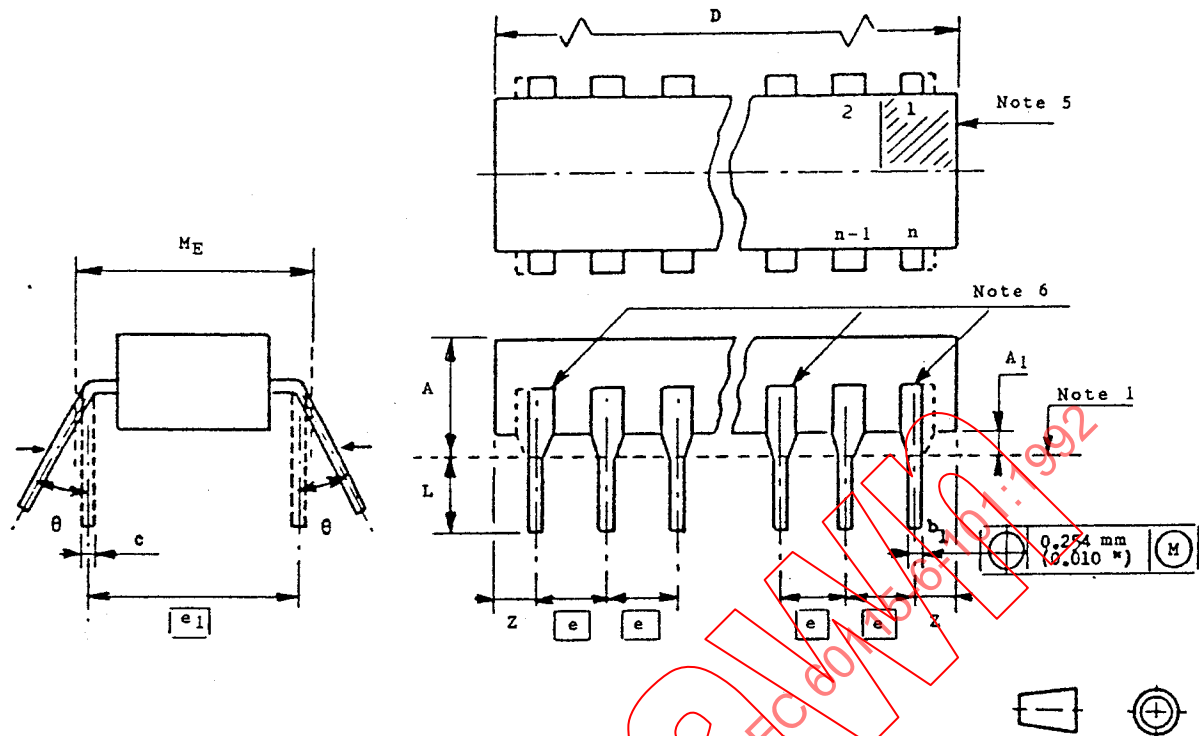
SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD OF MOUNTING

These resistor networks are designed for soldering into a printed board and shall therefore be mounted for testing in accordance with Sub-clause 3.1.1.b of IEC Publication 68-2-6 and Sub-clause 3.3.1.b of IEC Publication 68-2-29: Clamping the leads only.

CROQUIS D'ENCOMBREMENT



Réf- erence	millimètres			degrés	Notes
	min.	nom.	max.		
A	-	-	5,1	-	1
A ₁	0,51	-	-	-	2
b ₁	0,35	-	0,59	-	3
c	0,20	-	0,36	-	4
e	-	2,54 (*)	-	-	5
e ₁	-	7,62 (*)	-	-	
L	2,54	-	3,4	-	
M _E	-	-	8,5	-	
O	-	-	-	0-15	

Réf- erence	Modèle AB	Modèle AC	Notes
n	14	16	4
D max	20,32 mm	22,86 mm	
Z max min	2,54 mm 1,50	2,54 mm 1,50	

Ce dessin est identique au dessin I-50a de la Publication 191-2 de la CEI.

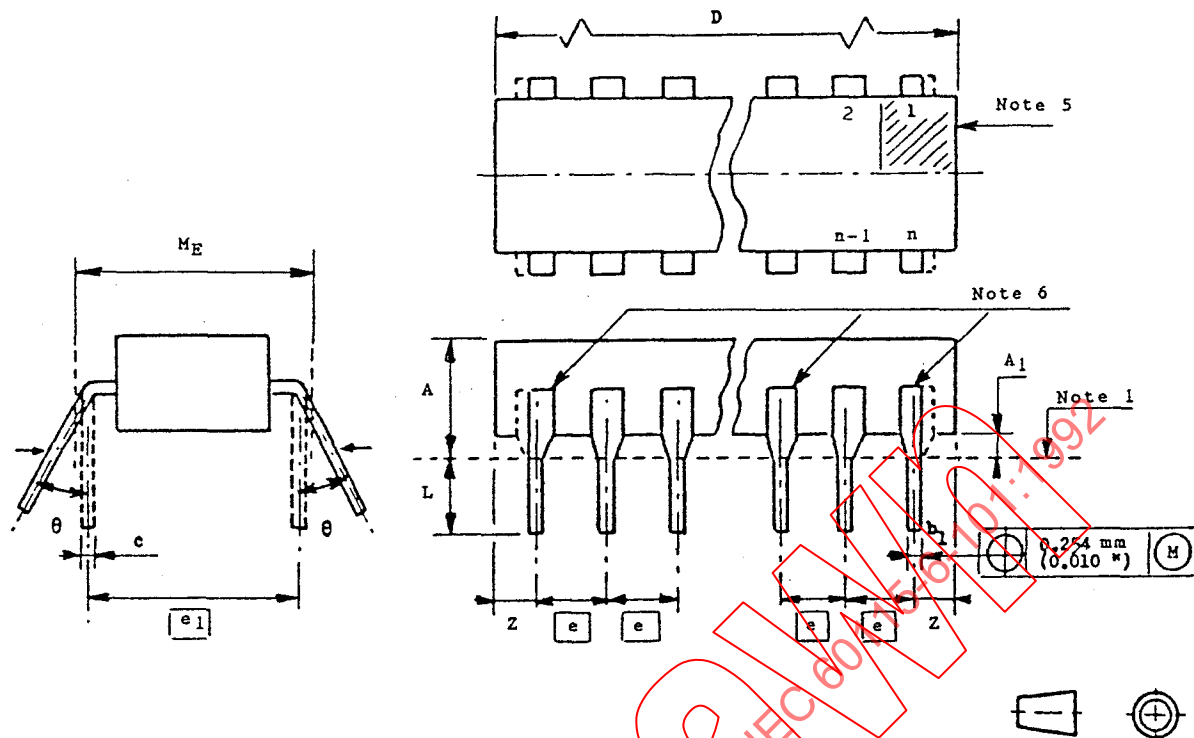
- 1 - Plan d'appui : Le plan d'appui est déterminé lorsque les sorties du dispositif sont insérées en butée dans les trous de diamètres 0,80 mm ± 0,05 mm, disposés axialement suivant la grille de module:

$$[e] / [e_1]$$

- 2 - Le principe du maximum de matière s'applique à la tolérance de position des sorties.
- 3 - Cette dimension correspond à la position géométrique exacte des axes des sorties au niveau du plan d'appui lorsque les sorties sont insérées en butée comme spécifié dans la note 1.
- 4 - n correspond au nombre total de positions de sorties.
- 5 - L'aire indexée identifie la sortie n° 1.
- 6 - La forme du pliage des sorties et leur contour, dans la limite de M_E et au dessus du plan d'appui, ne sont pas imposées, mais un espacement approprié doit exister pour que des conducteurs sur la surface de montage puissent passer entre les sorties.

(*) La position géométrique exacte.

OUTLINE DRAWINGS



Ref.	millimetres			degrees	Notes
	min.	nom.	max.		
A	-	-	5,1	-	1
A_1	0,51	-	-	-	2
b_1	0,35	-	0,59	-	2
c	0,20	-	0,36	-	2
e	-	2,54 (*)	-	-	3
e_1	-	7,62 (*)	-	-	3
L	2,54	-	3,4	-	4
M_E	-	-	8,5	-	5
O	-	-	-	0-15	-

Ref.	Style AB	Style AC	Notes
n	14	16	4
D max	20,32 mm	22,86 mm	
Z max	2,54 mm	2,54 mm	
min	1,50	1,50	

This drawing is identical to IEC Publication 191-2, drawing I-50a.

- 1 - Seating plane: the seating plane is determined when the device terminations are fully inserted into holes of diameter of $0,80 \pm 0,05 \text{ mm}$, the centres of which are located on a grid with e / e_1 as modulus.
- 2 - The maximum material condition applies to the positional tolerance of the terminations.
- 3 - This dimension refers to the true geometrical position of the termination axis at seating plane level, when the terminations are fully inserted as specified in Note 1.
- 4 - n refers to the total number of termination positions.
- 5 - Index area indicates termination no. 1.
- 6 - The termination bending form and termination contour inside M_E and above the seating plane are optional, but adequate clearance must be made so that conductors on the mounting area can pass between the terminations.

(*) Means true geometrical position.

1.2 DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES NOMINALESTABEAU I

Modèle	Nombre de sorties (N)	Dissipation nominale de l'élément à 70 °C (W)	Dissipation nominale du réseau à 70 °C (W)	Tension limite nominale (en courant continu ou alternatif efficace) (V)
AB	14	0,125	1,625	100
AC	16	0,125	1,875	100

Gamme de résistance*

10 Ω à 1 M Ω

Tolérances sur résistance nominale

 $\pm 1 \%$, $\pm 2 \%$ et $\pm 5 \%$

Catégorie climatique

55/125/56

Basse pression atmosphérique

8,5 kPa (85 mbar)

Classe de stabilité

1 %

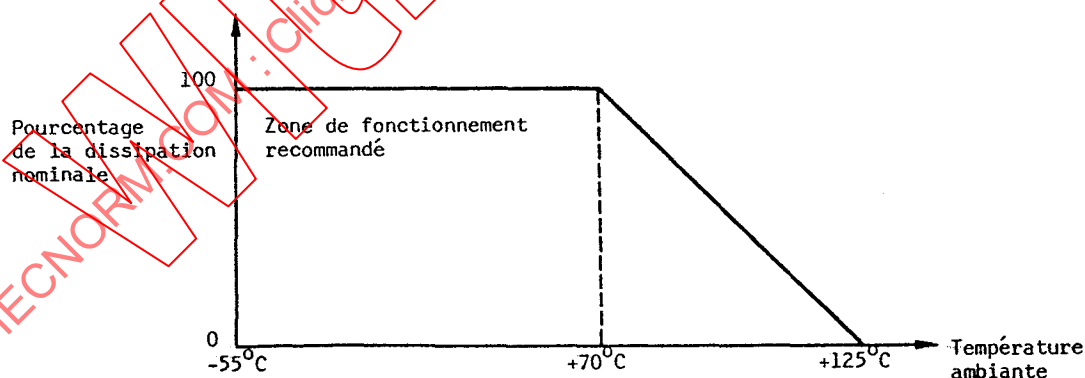
Limites de la variation de résistance:

- pour les essais de longue durée $\pm(1,0 \%R + 0,05 \Omega)$ - pour les essais de courte durée $\pm(0,25 \%R + 0,05 \Omega)$

Coefficient de température

 $\alpha : \pm 100 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ pour $R > 100 \Omega$ $\alpha : \pm 250 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ pour $R \leq 100 \Omega$ 1.2.1 REDUCTION DE LA DISSIPATION

La dissipation des résistances couvertes par cette spécification ne doit pas dépasser les valeurs indiquées par la courbe ci-après:



Note. -Voir également paragraphe 2.2.3 de la spécification intermédiaire.

* Les valeurs préférentielles sont celles de la (des) série(s) E... de la Publication 63 de la CEI: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

1.2 DIMENSIONS, RATINGS AND CHARACTERISTICSTABLE I

Style	Number of terminations (N)	Rated element dissipation at 70 °C (W)	Rated network dissipation at 70 °C (W)	Limiting element voltage (V d.c. or a.c. r.m.s.)
AB	14	0,125	1,625	100
AC	16	0,125	1,875	100

Resistance range*

10 Ω to 1 M Ω

Tolerance on rated resistance

 $\pm 1\%$, $\pm 2\%$ and $\pm 5\%$

Climatic category

55/125/56

Low air pressure

8,5 kPa (85 mbar)

Stability class

1 %

Limits for change of resistance:

- for long term tests

 $\pm(1,0\%R + 0,05\Omega)$

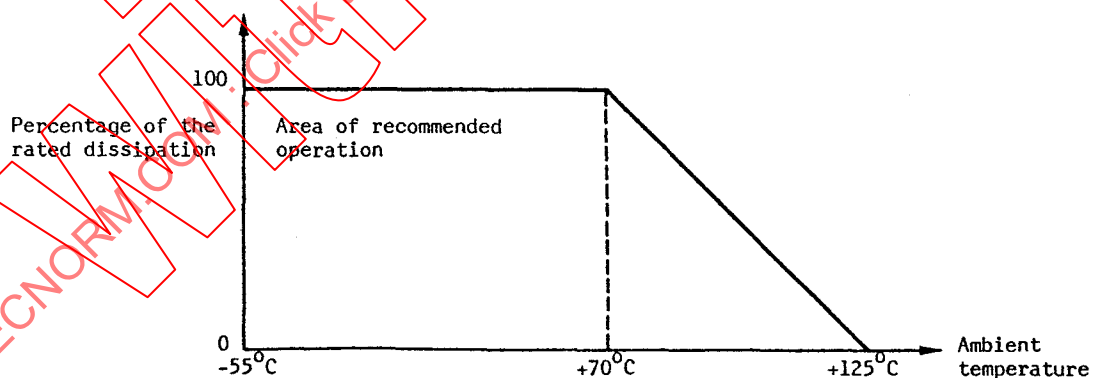
- for short term tests

 $\pm(0,25\%R + 0,05\Omega)$

Temperature coefficient

 $\alpha : \pm 100 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ for $R > 100\Omega$ $\alpha : \pm 250 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ for $R \leq 100\Omega$ 1.2.1 DERATING

Resistors covered by this specification are derated according to the following curve:



Note. -See also Sub-clause 2.2.3 of the sectional specification.

* The preferred values are those of the E-series of IEC Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique:	Publication 115-1 (1982) de la CEI: Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques. Première partie: Spécification générique. Modification No. 2 (1987).
Spécification intermédiaire:	Publication 115-6 (1983) de la CEI: Sixième partie: Spécification intermédiaire: Réseaux de résistan- ces fixes à résistances mesurables individuellement. Modification No. 1 (1987).
Spécification particulière-cadre:	Publication 115-6-1 (1983) de la CEI: Sixième partie: Spécification particulière-cadre: Réseaux de résistances fixes, de valeur égale et de dissipation égale, mesurables individuellement. Niveau d'assurance E.

1.4 MARQUAGE

Les informations de marquage minimales suivantes doivent être données sur le réseau de résistances:

- 1) L'identification du réseau permettant de se référer à la spécification particulière pour l'identification de chaque élément;
- 2) La broche No. 1 doit être identifiée par un chanfrein, ou un point, ou une ligne pointillée ou le chiffre 1 adjacent à la broche No. 1;
- 3) Résistance nominale de l'élément et tolérance;

L'emballage contenant les composants doit être marqué lisiblement avec 1) et 3) ci-dessus et en plus avec:

- 4) La date de fabrication (si elle n'est pas marquée sur le réseau de résistances);
- 5) Spécification particulière et modèle;
- 6) Nom du fabricant ou marque de fabrique.

1.3 RELATED DOCUMENTS

Generic Specification:

IEC Publication 115-1 (1982): Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987).

Sectional Specification:

IEC Publication 115-6 (1983):
Part 6: Sectional Specification:
Fixed Resistor Networks with individually measurable Resistors.
Amendment No. 1 (1987).

Blank Detail Specification:

IEC Publication 115-6-1 (1983):
Part 6: Blank Detail Specification:
Fixed Resistor Networks with individually measurable Resistors, all of equal value and equal dissipation.
Assessment level E.

1.4 MARKING

The following minimum marking information shall be given on the resistor network:

- 1) Network identification which enables reference back to the detail specification for identification of each element;
- 2) Pin 1 shall be identified by an adjacent bevel, dot, dotted line or the numeral 1;
- 3) Rated element resistance and tolerance;

The package containing the networks shall be clearly marked with 1) and 3) above and in addition with:

- 4) The date of manufacture (if not marked on the resistor network);
- 5) Detail specification and style;
- 6) Manufacturer's name or trade mark.

1.5 RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

Les commandes de réseaux de résistances couverts par cette spécification doivent contenir au minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

- (a) Résistance nominale de l'élément;
- (b) Tolérance sur la résistance nominale;
- (c) Numéro et édition de la spécification particulière, référence du modèle et nombre de sorties.

1.6 RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTES

Non requis.

Withdrawing
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60115-6-101:1992

1.5 ORDERING INFORMATION

Orders for networks covered by this specification shall contain, in clear or in coded form, the following minimum information:

- (a) Rated element resistance;
- (b) Tolerance on rated resistance;
- (c) Number and issue number reference of the detail specification and style reference and number of terminations.

1.6 CERTIFIED RECORDS OF RELEASED LOTS

Not required.

Withdawn
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 60115-6-101:1992

SECTION DEUX- EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2.1 Procédures

2.1.1 Pour l'homologation la procédure doit être conforme au paragraphe 3.2 de la spécification intermédiaire, Publication 115-6 de la CEI.

2.1.2 Pour le contrôle de la conformité de la qualité, le programme d'essais, comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences est donné au tableau II. La formation des lots de contrôle est régie par le paragraphe 3.3.1 de la spécification intermédiaire.

TABLEAU II

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient à la spécification générique des résistances fixes: Publication 115-1 de la CEI; cependant les exigences concernant les variations de résistance sont à choisir dans les tableaux I et II de la spécification intermédiaire, Publication 115-6 de la CEI.

2. -Les niveaux de contrôle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI: Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs.

3. -Dans ce tableau:

p = périodicité (en mois)

n = effectif de l'échantillon

c = critère d'acceptation (nombre admissible de défectueux)

D = destructif

ND = non destructif

NC = niveau de contrôle

NQA = niveau de qualité acceptable } Publication 410 de la CEI

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C	N Q A	Exigences (voir note 1)
			(voir note 2)		
<u>CONTROLE DU GROUPE A</u> (lot par lot)					
<u>Sous-groupe A1</u> 4.4.1 Examen visuel	ND		S-4	1,0%	Selon 4.4.1 Marquage lisible et selon 1.4 de la pré- sente spécification
<u>Sous-groupe A2</u> 4.4.2 Dimensions (au calibre)	ND		S-4	1,0%	Voir croquis d'encom- brement de la pré- sente spécification
4.5 Résistance					Selon 4.5.2

SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS2. INSPECTION REQUIREMENTS2.1 Procedures

- 2.1.1 For Qualification Approval the procedure shall be in accordance with the Sectional Specification, IEC Publication 115-6, Sub-clause 3.2.
- 2.1.2 For Quality Conformance Inspection the test schedule (Table II) includes sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by Sub-clause 3.3.1 of the sectional specification.

TABLE II

Notes 1. -Sub-clause numbers of tests and performance requirements refer to the Generic Specification, IEC Publication 115-1, except for resistance change requirements, which shall be selected from the Tables I and II of the sectional specification, IEC Publication 115-6, as appropriate.

2. -Inspection Levels and AQL's are selected from IEC Publication 410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.

3. -In this table:

p = periodicity (in months)
 n = sample size
 c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
 D = destructive
 ND = non-destructive
 IL = inspection level
 AQL = acceptable quality level } IEC Publication 410

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
(see Note 2)					
<u>GROUP A INSPECTION</u> (lot-by-lot)					
<u>Sub-group A1</u>	ND		S-4	1,0%	
4.4.1 Visual examination					As in 4.4.1 Legible marking and as specified in 1.4 of this specification
<u>Sub-group A2</u>	ND		S-4	1,0%	
4.4.2 Dimensions (gauging)					See outline drawing in this specification
4.5 Resistance					As in 4.5.2

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	N C	N Q A	Exigences (voir note 1)
			(voir note 2)		
<u>CONTROLE DU GROUPE B</u> (lot par lot)					
<u>Sous-groupe B1</u>	ND		S-3	1,0%	
4.7 Tension de tenue (réseaux isolés seulement)		Méthode de la feuille métallique			Pas de claquage, ni de contournement
<u>Sous-groupe B2</u>	D		S-3	2,5%	
4.17 Soudabilité		Sans vieillissement Bain de soudure, méthode 1 Température de bain: 230 °C Temps d'immersion: 2 s			Bon étamage mis en évidence par l'écou- lement libre de l'al- liage avec un mouil- lage convenable des sorties
4.19 Variations rapides de température		$\theta_A = -55\text{ °C}$ $\theta_B = +125\text{ °C}$ Examen visuel Résistance			Pas de dommage visible $\Delta R \leq \pm(0,25\ \%R +$ 0,05 $\Omega)$

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
<u>CONTROLE DU GROUPE C</u> (périodique)						
<u>Sous-groupe C1A</u>	D		3	5		
Moitié de l'échantillon du Sous-groupe C1						
4.16 Robustesse des sorties		Voir 2.3.9 de la spécification intermédiaire Examen visuel Résistance				Pas de dommage visible $\Delta R \leq \pm(0,25\ \%R + 0,05\ \Omega)$

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	I L	A Q L	Performance requirements (see Note 1)
(see Note 2)					
<u>GROUP B INSPECTION</u> (lot-by-lot)					
<u>Sub-group B1</u>	ND		S-3	1,0%	
4.7 Voltage proof (insulated networks only)		Method: Foil method			No breakdown or flashover
<u>Sub-group B2</u>	D		S-3	2,5%	
4.17 Solderability		Without ageing Solder bath, Method 1 Bath temperature: 230 °C Immersion time: 2 s			Good tinning as evi- denced by free flowing of the solder with wetting of the terminations
4.19 Rapid change of temperature		$\theta_A = -55\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\theta_B = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$ Visual examination Resistance			No visible damage $\Delta R \leq \pm(0,25\text{ \%}R + 0,05\text{ }\Omega)$

Sub-clause number and Test (see Note 1)	D or ND	Conditions of test (see Note 1)	Sample size & criterion of accepta- bility (see Note 3)			Performance requirements (see Note 1)
			p	n	c	
<u>GROUP C INSPECTION</u> (periodic)						
<u>Sub-group ClA</u>	D		3	5		
Half of the sample of Sub-group Cl						
4.16 Robustness of terminations		See 2.3.9 of the sectional specification Visual examination Resistance				No visible damage $\Delta R \leq \pm(0,25 \% R + 0,05 \Omega)$

Numéro de paragraphe et essai (voir note 1)	D ou ND	Conditions d'essai (voir note 1)	Effectif de l'échantillon et critère d'acceptation (voir note 3)			Exigences (voir note 1)
			p	n	c	
4.18 Résistance à la chaleur de sou- dage		Méthode 1A				
		Examen visuel				Pas de dommage visible Marquage lisible
		Résistance				$\Delta R \leq \pm(0,25 \% R + 0,05 \Omega)$
4.8 Variation de résistance en fonction de la température		-55/20 °C				Pour $R > 100 \Omega$: $\frac{\Delta R}{R} \leq \pm 0,75 \%$
						Pour $R \leq 100 \Omega$: $\frac{\Delta R}{R} \leq \pm 1,88 \%$
		20/125 °C				Pour $R > 100 \Omega$: $\frac{\Delta R}{R} \leq \pm 1,05 \%$
						Pour $R \leq 100 \Omega$: $\frac{\Delta R}{R} \leq \pm 2,62 \%$
4.13 Surcharge		Voir 2.3.4 de la spéci- fication intermédiaire				
		Examen visuel				Pas de dommage visible Marquage lisible
		Résistance				$\Delta R \leq \pm(0,25 \% R + 0,05 \Omega)$
<u>Sous-groupe ClB</u>			3	5		
Autre moitié de l'échantillon du Sous-groupe Cl						
4.19 Variations rapides de température		$\theta_A = -55 \text{ °C}$				
		$\theta_B = +125 \text{ °C}$				
		Examen visuel				Pas de dommage visible
		Résistance				$\Delta R \leq \pm(0,25 \% R + 0,05 \Omega)$